

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005年11月3日 (03.11.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/104159 A1(51) 国際特許分類⁷:

H01H 71/16

(74) 代理人: 大岩 増雄, 外 (OIWA, Masuo et al.); 〒 6610012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目14-1 Hyogo (JP).

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/005705

(22) 国際出願日:

2004年4月21日 (21.04.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三菱電機株式会社 (MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1008310 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 川村 浩司 (KAWAMURA, Kouji) [JP/JP]; 〒1008310 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内 Tokyo (JP). 秋田 裕之 (AKITA, Hiroyuki) [JP/JP]; 〒1008310 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内 Tokyo (JP). 村井 正俊 (MURAI, Masatoshi) [JP/JP]; 〒1008310 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内 Tokyo (JP). 米澤 宏敏 (YONEZAWA, Hirotoshi) [JP/JP]; 〒1008310 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内 Tokyo (JP). 内藤 悟 (NAITO, Satoru) [JP/JP]; 〒1008310 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

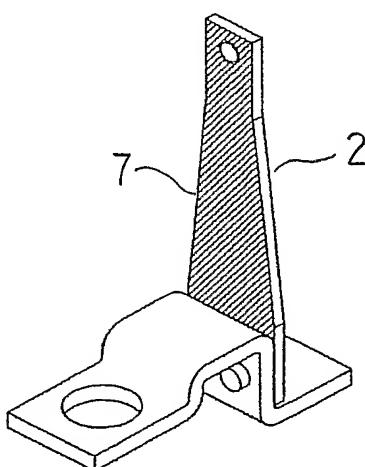
添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドノート」を参照。

(54) Title: THERMAL TYPE TRIPPING DEVICE AND CIRCUIT BREAKER USING THE SAME

(54) 発明の名称: 熱動式引き外し装置及びそれを用いた回路遮断器



(57) **Abstract:** A thermal type tripping device adapted to trip a circuit in that a bimetal (2) is heated by overcurrent to cause the curving of the bimetal (2), wherein at least part of the surface of the bimetal (2) has a black color or matte black color (7). This makes it possible to measure the temperature of the bimetal (2) with high accuracy by using a non-contact type thermometer. Further, the temperature measuring section (8) of the bimetal is provided with a bend process section (11) whose surface has a matte black color.

(57) **要約:** 過電流によりバイメタル (2) が加熱され、加熱されたバイメタル (2) の湾曲により、回路の引き外し動作を行う熱動式引き外し装置において、バイメタル (2) の表面の少なくとも1部を黒色又はつや消しの黒色 (7) としたものである。このことによって、非接触式温度計を用いて、バイメタル (2) の温度を高精度に計測することが可能になる。また、バイメタルの温度計測部 (8) に曲げ加工部 (11) を設け、その表面をつや消しの黒色とした。

明細書

熱動式引き外し装置及びそれを用いた回路遮断器

5 技術分野

本発明は、熱動式引き外し装置及びそれを用いた回路遮断器に関するものである。

背景技術

10 熱動式引き外し装置は、例えば、回路遮断器において過電流を検出し、主回路の引き外しを行う装置である。過電流が流れた際の引き外し特性は、J I S等の規格でその範囲が定められており、製品はそれを満たす必要がある。しかし、熱動式引き外し装置においては、構成する部品の製作ばらつきや素材のばらつきのため、引き外し特性のばらつきが避けられない。そこで通常は引き外し特性を調整するための構造が組み込んであり、特性の調整・検査を行っている。

引き外し特性を調整・検査するためには、その特性値を正確に測定する必要がある。熱動式引き外し装置では、所定電流を通電して通電開始から引き外し完了までの時間（トリップ時間）やバイメタル変位量を計測することにより引き外し特性を測定することが多い。一方、バイメタルの湾曲係数は既知であるため、バイメタル温度を測定することでバイメタル変位量を求めることができる。従って、バイメタル温度を測定することによって引き外し特性を把握することができる。

バイメタル温度を計測するにあたっては、計測によってバイメタル湾曲量に影響を及ぼさないために、非接触で測定する方法が望ましい。接触式温度計による計測では、測定子を介してバイメタルに外部から

荷重が加わるためバイメタルに撓みが生じ、引き外し特性を変化させてしまう。非接触温度測定方法としては、赤外線吸収素子を組み込んだ放射温度計を用いるのが一般的である。

しかし、通常のバイメタル表面は、金属光沢面であるため正確な温度計測が難しいという問題がある。また、漏電検出回路を組み込んだ漏電回路遮断器や、小型化された回路遮断器においては、バイメタル周囲の隙間が少ないため、バイメタル表面温度を外部から測定するの5は困難である。

本発明は、かかる課題を解決するためになされたものであり、非接10触式温度計を用いて、バイメタル温度を高精度に計測することが可能な熱動式引き外し装置及びそれを用いた回路遮断器の提供を目的としている。

発明の開示

15 本発明にかかる熱動式引き外し装置は、過電流によりバイメタルが加熱され、加熱されたバイメタルの湾曲により回路の引き外し動作を行う熱動式引き外し装置において、バイメタルの表面の少なくとも1部を黒色又はつや消しの黒色としたものである。

このことによって、非接触式温度計を用いて、バイメタル温度を高20精度に計測することが可能になる。

また、本発明は、バイメタルの温度計測部の表面を黒色又はつや消しの黒色としたものである。

また、本発明は、バイメタルの温度計測部に、バイメタルの長手方向にほぼ直角に曲げた曲げ加工部を設け、その表面を黒色又はつや消25しの黒色としたものである。

このことによって、バイメタル面のほぼ垂直方向から計測が困難な

機種でも安定して高精度な温度計測が可能となる。

また、本発明は、バイメタルの温度計測部に、バイメタルの長手方向にほぼ直角に曲げた曲げ加工部を設けたものである。

このことによって、バイメタルの長手方向から計測ができ、安定して高精度な温度計測が可能となる。

図面の簡単な説明

第1図は、本発明の実施の形態1における熱動式引き外し装置のバイメタル部を示す斜視図である。

第2図は、実施の形態2における熱動式引き外し装置のバイメタル部を示す斜視図である。

第3図は、実施の形態3における熱動式引き外し装置のバイメタル部を示す斜視図である。

第4図は、実施の形態4における熱動式引き外し装置のバイメタル部を示す斜視図である。

第5図は、実施の形態2に係わるバイメタルの素材加工段階を示す平面図である。

第6図は、実施の形態3に係わるバイメタルの素材加工段階を示す平面図である。

第7図は、非接触温度計を用いて実施の形態3のバイメタルの温度を計測する様子を示す図である。

第8図は、非接触温度計を用いて実施の形態4のバイメタルの温度を計測する様子を示す図である。

第9図は、熱動式引き外し装置を有する回路遮断器の構造を示す一部切り正面図である。

発明を実施するための最良の形態

実施の形態 1.

回路遮断器は定格以上の過電流が流れた時に回路を遮断し、事故を防ぐための安全装置である。回路遮断器において、過電流を検出する機構を引き外し機構といい、その検出手段の一つにバイメタルを用いた熱動式がある。これはバイメタルが温度変化によって湾曲する特性を利用したものである。第9図は熱動式引き外し機構、即ち、熱動式引き外し機構装置を備えた回路遮断器の構造を示す一部切り正面図である。

定格電流以上の過電流が流れたときの動作は以下のとおりである。

(1) ヒータ1あるいはバイメタル2に過電流が流れることにより、ヒータ1あるいはバイメタル2の温度が上昇する。

(2) バイメタル2の温度の上昇に伴ってバイメタル2が湾曲する。

(3) バイメタル2の湾曲量が大きくなり、トリップバー3を押す。

(4) 機構部4が作動して主回路5を瞬時に遮断する(トリップする)。

過電流が流れはじめてからトリップするまでの時間は、JIS等の規格により範囲が定められており、製品のトリップ時間は、その範囲を満足しなければならない。しかし、引き外し機構の作動点、すなわち、バイメタル2がトリップバー3を押す位置が、引き外し機構を構成する各部品の加工・組立誤差、材料特性のばらつき等、製造ばらつきの累積によりばらついて、通電開始からトリップするまでの時間(トリップ時間)にばらつきが生じる。そこで、このような製造ばらつきを吸収するために、バイメタル2先端やトリップバー3に調整機構6を設け、組立工程において調整・検査作業を行っている。

調整・検査作業では、ワーク毎の引き外し特性を正確に測定する必要がある。通常は所定の電流値を通電してトリップ時間を計測したり、

その間のバイメタル変位量を計測することにより、引き外し特性を測定することが多い。しかしトリップ時間やバイメタル変位量は、通電開始時のワーク温度や測定環境温度に大きく影響されるため、一定温度に管理された状態で計測するか、もしくはワーク温度や周囲温度に基づいて計測値を補正しなければならない。

一方、バイメタルはその温度と湾曲係数によって湾曲量（変位量）が決定するが、湾曲係数は既知であるため、バイメタル温度を計測することにより変位量を求めることができる。従って、バイメタル温度を計測することによって、引き外し特性を測定することが可能である。

バイメタル温度を計測するには、一般的には非接触式の放射温度計を用いる。これは接触式温度計を用いると測定子の接触荷重によってバイメタルのたわみが生じて引き外し特性が変わってしまい、正確な引き外し特性の測定ができないためである。

非接触式温度計は物体から放射される赤外線の放射エネルギー量を検知することで物体の温度を測定する。物体から放射される赤外線の放射量は、材質やその表面状態により違いがあり、同一温度であっても放射する赤外線エネルギー量（放射率）は異なる。非接触温度計では理想黒体（放射率 100% の理論的な物体）を基準に温度を算出しており、それ以外の物体では個々の放射率に合わせて補正を行わなければならぬ。

放射率は通常実験的に得られるもので、測定物の放射率を短時間で求めることは困難なため、量産工程でワーク毎に放射率を求ることはできない。従って、バイメタルの放射率がばらついている場合には、そのばらつきが温度計測のばらつきとなってしまう。さらに、バイメタル表面は一般には金属光沢面となっているため、ヒータ等のバイメタル近傍にある他の熱源から放射される赤外線がバイメタル表面で反

射され易い。その反射光が放射温度計に入射してしまうと測定誤差となってしまう。

また、放射率が低い場合でも放射率に応じて補正をかけることで温度の測定は可能であるが、赤外線の絶対量が少なくなるので測定でのノイズ成分が多くなり、温度測定精度が低下してしまう。よって、高精度な温度計測のためには放射率が高くかつ一定であることが望ましい。

そこで、本発明ではバイメタル2の温度計測部となる表面を黒色、望ましくは、つや消し黒色7（第1図参照）とすることにより放射率を高くしつつ一定にした。これにより異なるワークでも一定の高い放射率となるため、バイメタル温度を高精度に安定して測定できる。また、つや消し塗装とすることで他の熱源からの反射を抑えることができ、計測誤差を少なくできる。第1図は本発明の実施の形態1における熱動式引き外し装置のバイメタル部を示す斜視図である。黒色とするには例えば塗装やエッチングによる方法がある。つや消し黒色にするには、つや消し用の黒色塗料を使用すれば良い。また、エッチングと共に酸化させることによりつや消し黒色にしても良い。この場合、エッチング液としては、バイメタル2が鉄系の素材のときは、例えば水酸化ナトリウム溶液や磷酸塩溶液を用い、銅系の素材のときは、例えばセレンを含有する酸性水溶液を用いる。

実施の形態2.

バイメタル温度を高精度に計測するためには、バイメタル内での温度測定位置、即ち温度計測部8（第2図参照）を固定しておく必要がある。これはヒータによるバイメタル2の加熱においては、バイメタル全体を均一に加熱することは難しいので、バイメタル2内で温度分

布が存在するためである。従って、実施の形態 1 に記載したバイメタル 2 の表面の黒化処理を温度計測部に施せばよい。第 2 図は実施の形態 2 における熱動式引き外し装置のバイメタル部を示す斜視図である。

通常、回路遮断器に用いるバイメタル 2 は細長いバイメタル素材 9 5 からプレス加工により製造される（第 5 図参照）。従って素材 9 の段階で温度計測部になる箇所のみを黒色、望ましくは、つや消し黒色 7 としておき、それをプレス加工することで必要な箇所のみを黒色化したバイメタル片を得ることができる。第 5 図は実施の形態 2 に係わるバイメタルの素材加工段階を示す平面図である。バイメタル片の状態 10 で黒色化処理するよりも素材状態で一括して処理した方が加工工程が簡略化でき、加工費の低減となる。また、実施の形態 2 のように処理部分を最小限とすることによって、さらに加工費の低減となる。

実施の形態 3 .

バイメタル素材 9 に 2 箇所の黒色部を設けた例を図 6 に示す。バイメタルの形状には先端に向けて徐々に幅が狭くなっているものもあり、その場合はバイメタル片の向きを交互に組み合わせてプレス加工することで素材 9 の歩留まりを上げることができる。ロール状素材からバイメタル素材 9 を引出し 2 本の黒色部を設けておき、それから図のようにプレス加工される。実施の形態 3 で形成されたバイメタルを用いた熱動式引き外し装置の主要部の斜視図を第 3 図に示す。

実施の形態 4 .

非接触温度計を用いて、バイメタルの温度を計測するには、バイメタルの温度計測部 8 から概垂直方向に温度計を設置し、その間に赤外線を遮る障害物の無い空間が必要である。第 7 図は非接触温度計 10

を用いて実施の形態 3 のバイメタル 2 の温度を計測する様子を示す図である。

しかし、例えば漏電回路遮断器ではバイメタルに隣接して漏電検出部が組み込まれており、上記空間が確保できない場合が多い。また、
5 回路遮断器においても製品の小型化によってバイメタル温度を測定できる箇所が限られてきており、バイメタル上の理想的な温度計測点を計測するのが不可能な場合がある。実施の形態 4 はこのような場合でも所望の場所での温度計測を可能とするものである。

実施の形態 4 における熱動式引き外し装置のバイメタル部の斜視図
10 を第 4 図に示す。バイメタルの温度計測部 8 となる箇所に曲げ加工部 11 を設ける。

第 8 図のようにバイメタルの長手方向から温度測定できるように、
バイメタルの温度計測部 8 に、バイメタル 2 の長手方向とほぼ直角に
曲げ加工部 11 を設ける。熱動式引き外し装置ではバイメタル 2 が湾
15 曲するためのスペースが必要なことと、引き外し特性を調整する必要
があることから、バイメタル 2 の長手方向には計測可能な空間がある
ことが多い。しかし、従来のバイメタルではこの方向からは板厚分しか
測定できる部分が無いため温度計測が非常に困難である。

そこでバイメタル 2 の温度計測部 8 となる箇所に曲げ加工を施して、
20 曲げ加工部 11 を設け、温度計測に必要な面積を確保することで、第
8 図のように、上方からバイメタル 2 の長手方向に並行に非接触温度
計 10 による温度計測が可能となる。曲げ加工を施す位置を変えるこ
とで、バイメタルの任意の場所での温度計測が可能である。

さらに、その曲げ加工部の表面で温度計測が行われる箇所には、曲
25 げ加工後又は曲げ加工前に黒色、望ましくは、つや消しの黒色にする
と、より一層、バイメタル温度を高精度に計測することが可能になる。

産業上の利用可能性

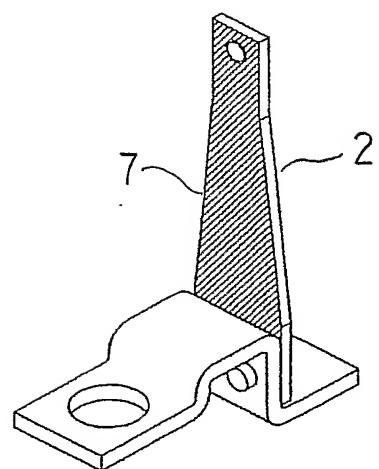
以上のように本発明の熱動式引き外し装置は、非接触式温度計を用いて、バイメタル温度を高精度に計測することが可能になるので、バイメタル変位量を正確に求めることができ、これを回路遮断器に適用して好適であり、回路遮断器の特性を容易に安定化させ得る。

請求の範囲

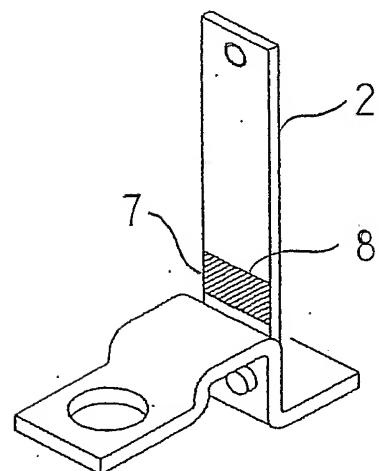
1. 過電流によりバイメタルが加熱され、加熱されたバイメタルの湾曲により回路の引き外し動作を行う熱動式引き外し装置において、バイメタルの表面の少なくとも1部を黒色としたことを特徴とする熱動式引き外し装置。
5
2. バイメタルの表面の少なくとも1部をつや消しの黒色としたことを特徴とする請求項1記載の熱動式引き外し装置。
3. バイメタルの温度計測部の表面を黒色としたことを特徴とする請求項1記載の熱動式引き外し装置。
10
4. バイメタルの上記温度計測部の表面をつや消しの黒色としたことを特徴とする請求項3記載の熱動式引き外し装置。
5. バイメタルの上記温度計測部に、バイメタルの長手方向にほぼ直角に曲げた曲げ加工部を設け、その表面を黒色としたことを特徴とする請求項3記載の熱動式引き外し装置。
15
6. バイメタルの上記温度計測部に、バイメタルの長手方向にほぼ直角に曲げた曲げ加工部を設け、その表面をつや消しの黒色としたことを特徴とする請求項4記載の熱動式引き外し装置。
7. 過電流によりバイメタルが加熱され、加熱されたバイメタルの湾曲により回路の引き外し動作を行う熱動式引き外し装置において、バイメタルの温度計測部に、バイメタルの長手方向にほぼ直角に曲げた曲げ加工部を設けたことを特徴とする熱動式引き外し装置。
20
8. 過電流によりバイメタルが加熱され、加熱されたバイメタルの湾曲により回路の引き外し動作を行う熱動式引き外し装置を有する回路遮断器において、バイメタルの温度計測部の表面を黒色としたことを特徴とする回路遮断器。
25

1 / 5

第1図

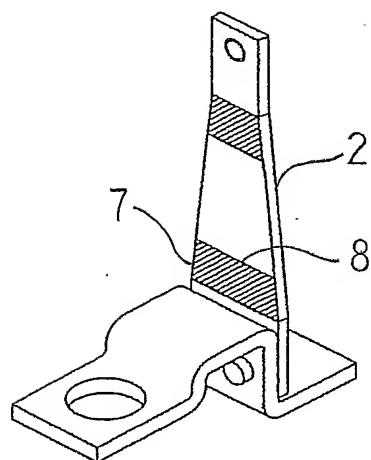


第2図

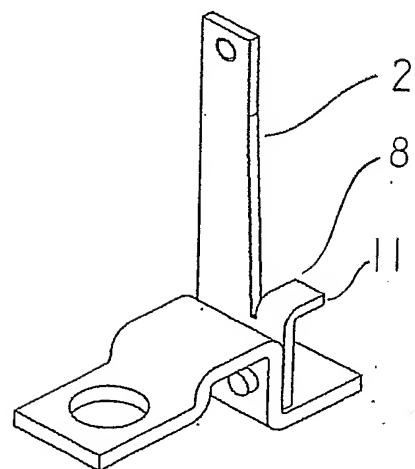


2 / 5

第3図

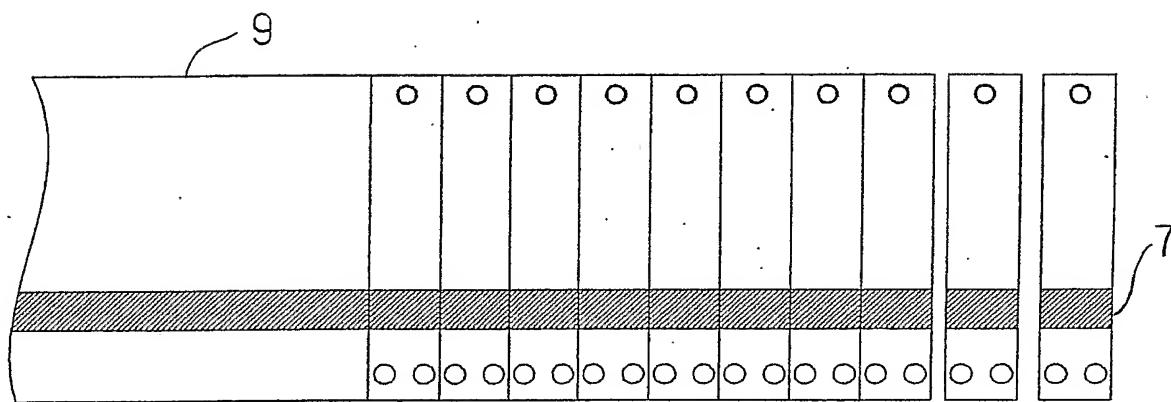


第4図

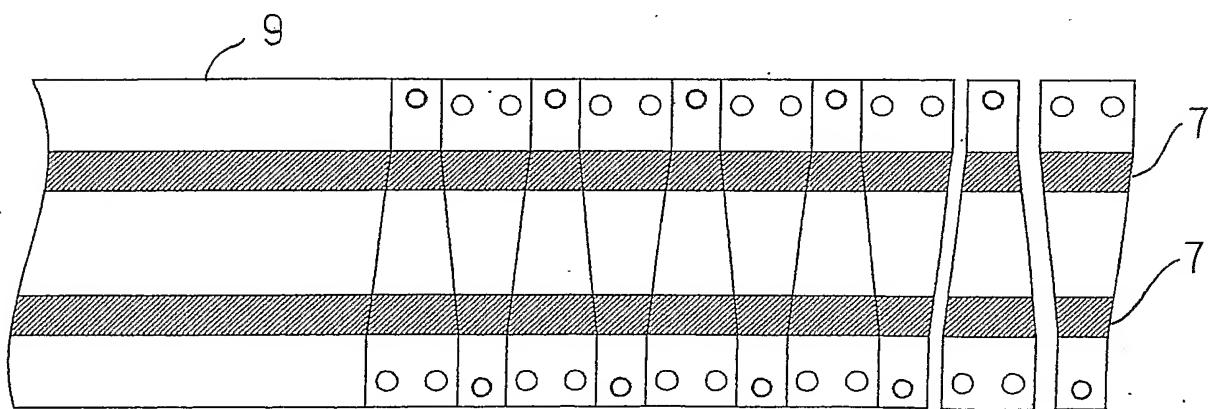


3 / 5

第 5 図

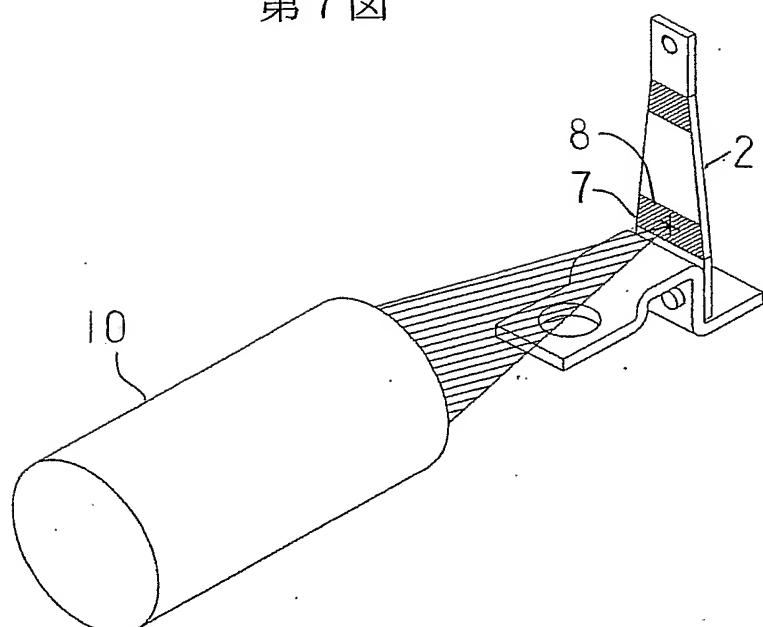


第 6 図

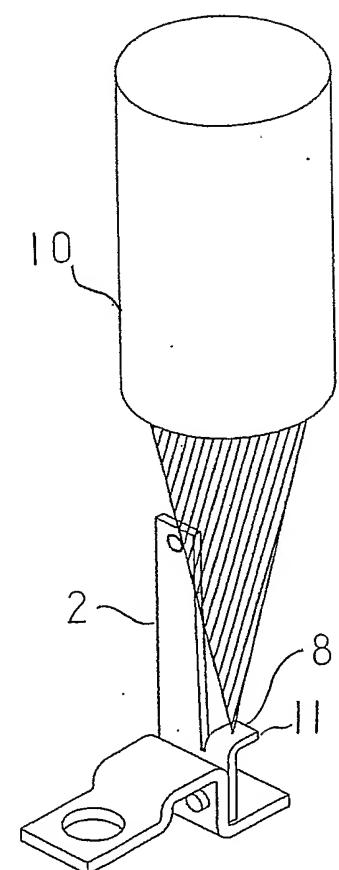


4 / 5

第 7 図

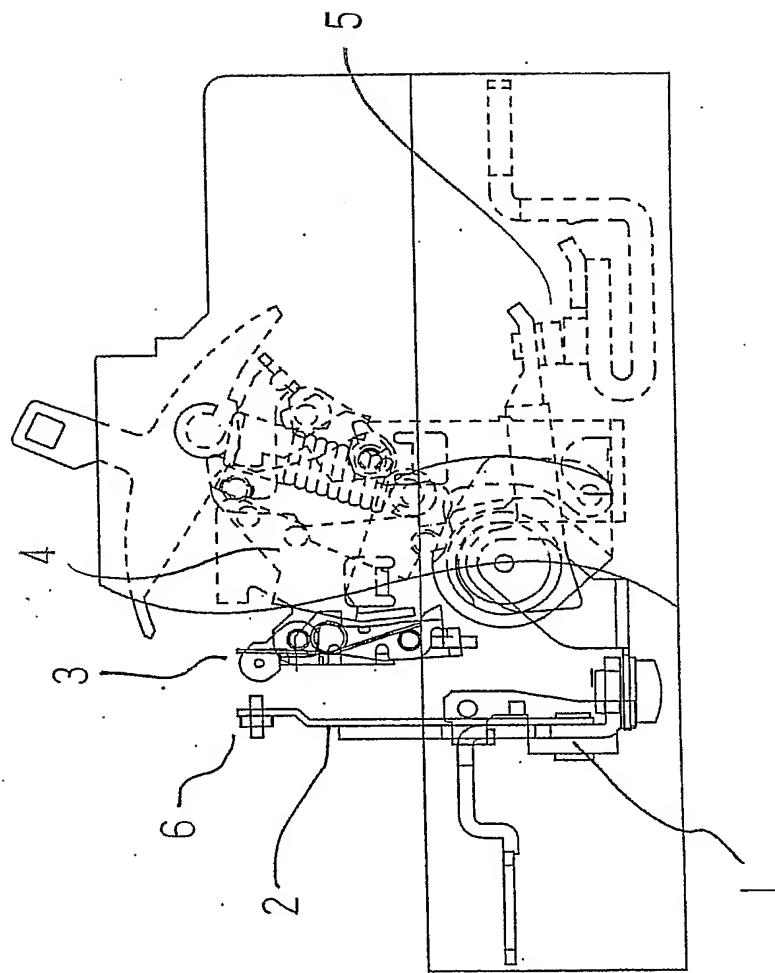


第 8 図



5 / 5

第9図



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/005705

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ H01H71/16

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl⁷ H01H71/16

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1940-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2002-324473 A (Matsushita Electric Works, Ltd.), 08 November, 2002 (08.11.02), Full text; Figs. 1 to 26 (Family: none)	1-8
A	JP 2002-245919 A (Matsushita Electric Works, Ltd.), 30 August, 2002 (30.08.02), Par. No. [0024]; Fig. 1 (Family: none)	1-8

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	
"A"	document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
"E"	earlier application or patent but published on or after the international filing date
"L"	document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
"O"	document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P"	document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
"T"	later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"Y"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"&"	document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search 03 August, 2004 (03.08.04)	Date of mailing of the international search report 17 August, 2004 (17.08.04)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/005705

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

Claims 1-6, 8 relate to a thermal type tripping device in which at least part of the surface of a bimetal has a black color.
Claim 7 relates to a thermal type tripping device in which the temperature measuring section of a bimetal is provided with a bend process section which is bent substantially at right angles longitudinally of the bimetal.

1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
 No protest accompanied the payment of additional search fees.

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. C17 H01H71/16

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. C17 H01H71/16

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

・日本国実用新案公報	1940-1996年
・日本国公開実用新案公報	1971-2004年
・日本国登録実用新案公報	1994-2004年
・日本国実用新案登録公報	1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2002-324473 A (松下電工株式会社) 2002.11.08, 全文, 第1-26図 (ファミリーなし)	1-8
A	JP 2002-245919 A (松下電工株式会社) 2002.08.30, 段落番号【0024】 , 図1 (ファミリーなし)	1-8

 C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
もの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日
以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する
文献(理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって
出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論
の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明
の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以
上の文献との、当業者にとって自明である組合せに
よって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

03.08.2004

国際調査報告の発送日

17.8.2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員)

井上 茂夫

3 X 8920

電話番号 03-3581-1101 内線 3370

第II欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見（第1ページの2の続き）

法第8条第3項（PCT17条(2)(a)）の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. 請求の範囲 _____ は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。つまり、
2. 請求の範囲 _____ は、有意義な国際調査をできる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. 請求の範囲 _____ は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。

第III欄 発明の単一性が欠如しているときの意見（第1ページの3の続き）

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。

請求の範囲1-6, 8は、バイメタルの表面の少なくとも一部を黒色とする、熱動式引き外し装置に関するものである。

請求の範囲7は、バイメタルの温度計測部にバイメタルの長手方向にほぼ直角に曲げた曲げ加工部を設けた熱動式引き外し装置に関するものである。

1. 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。